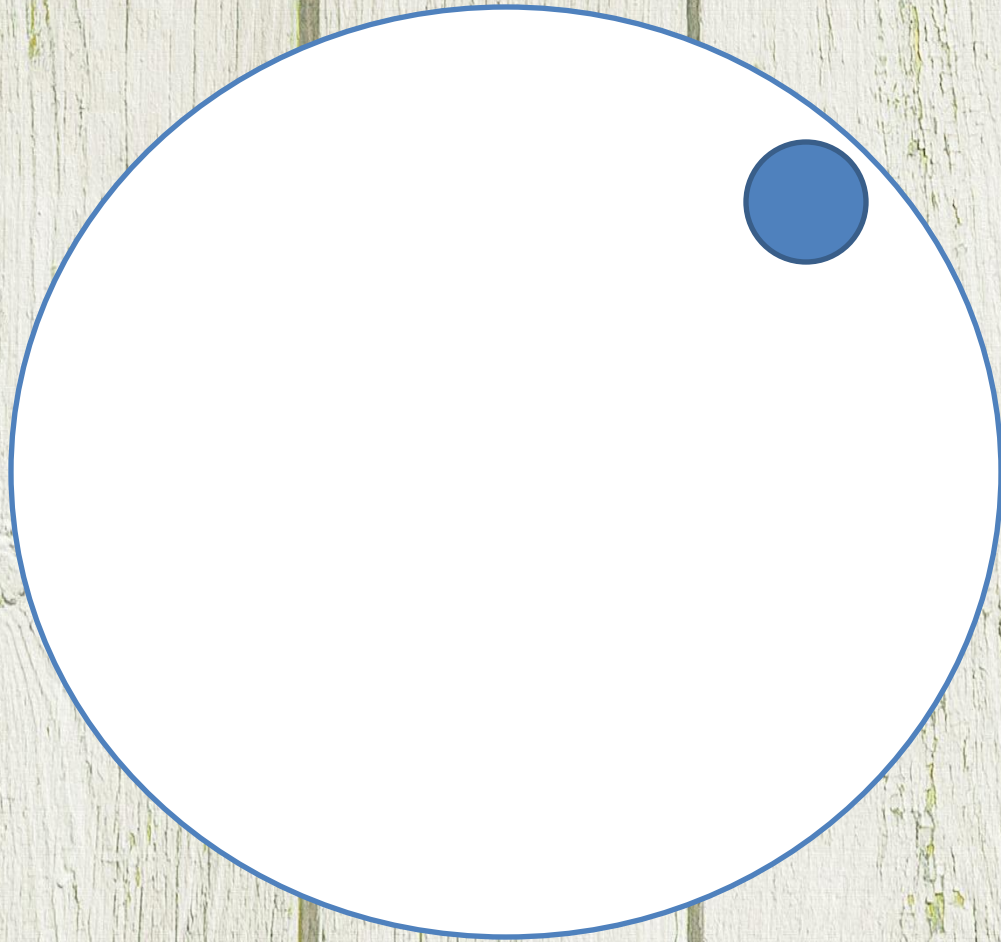
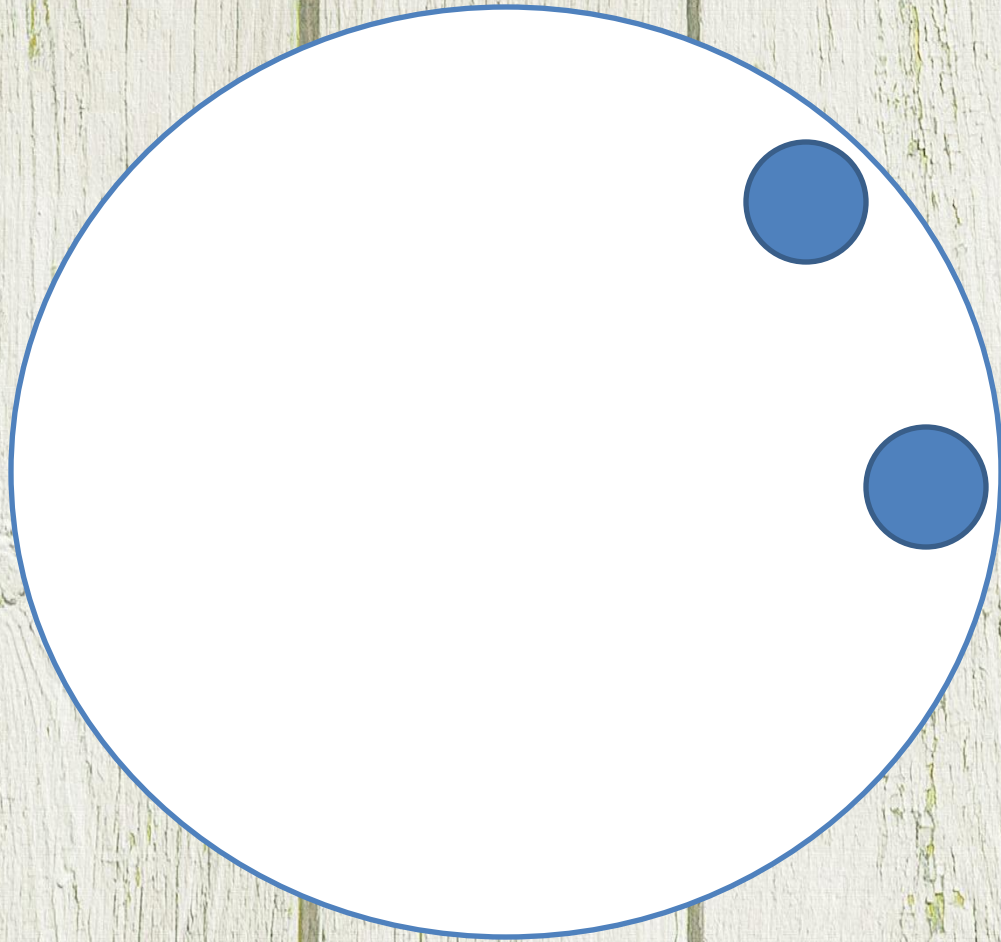


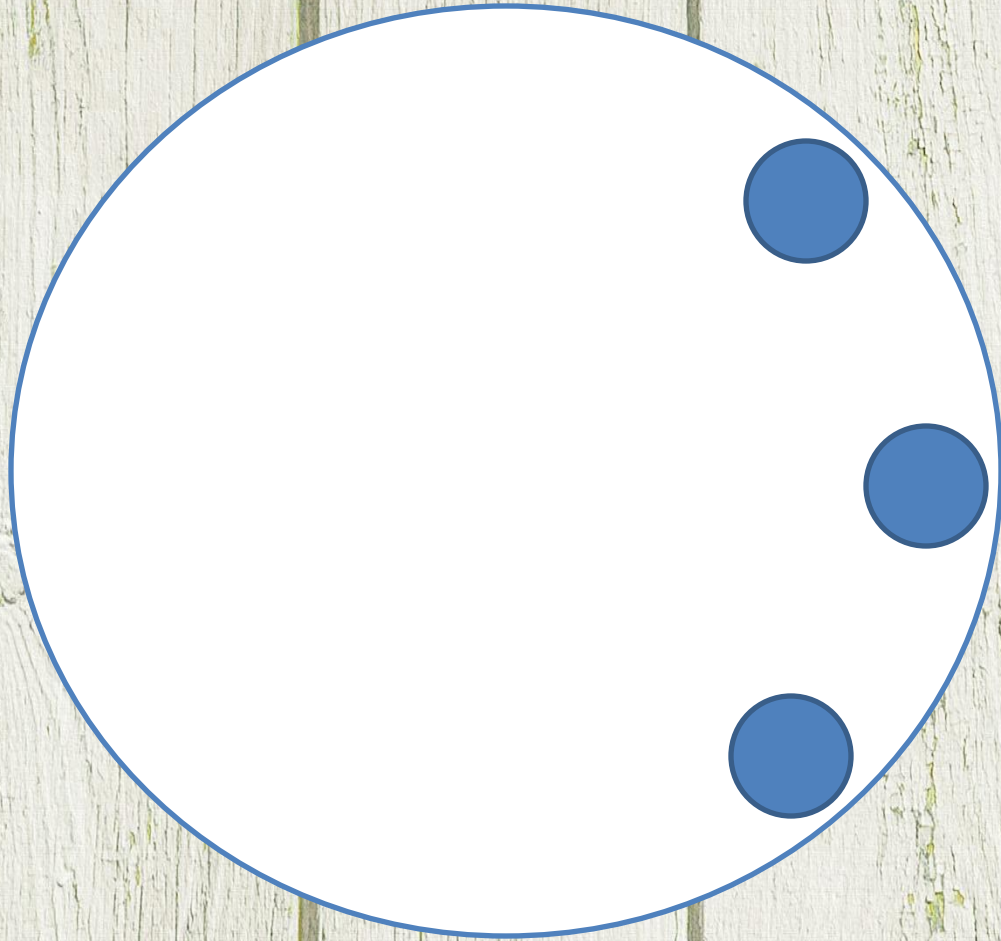
Микро и нано электроника

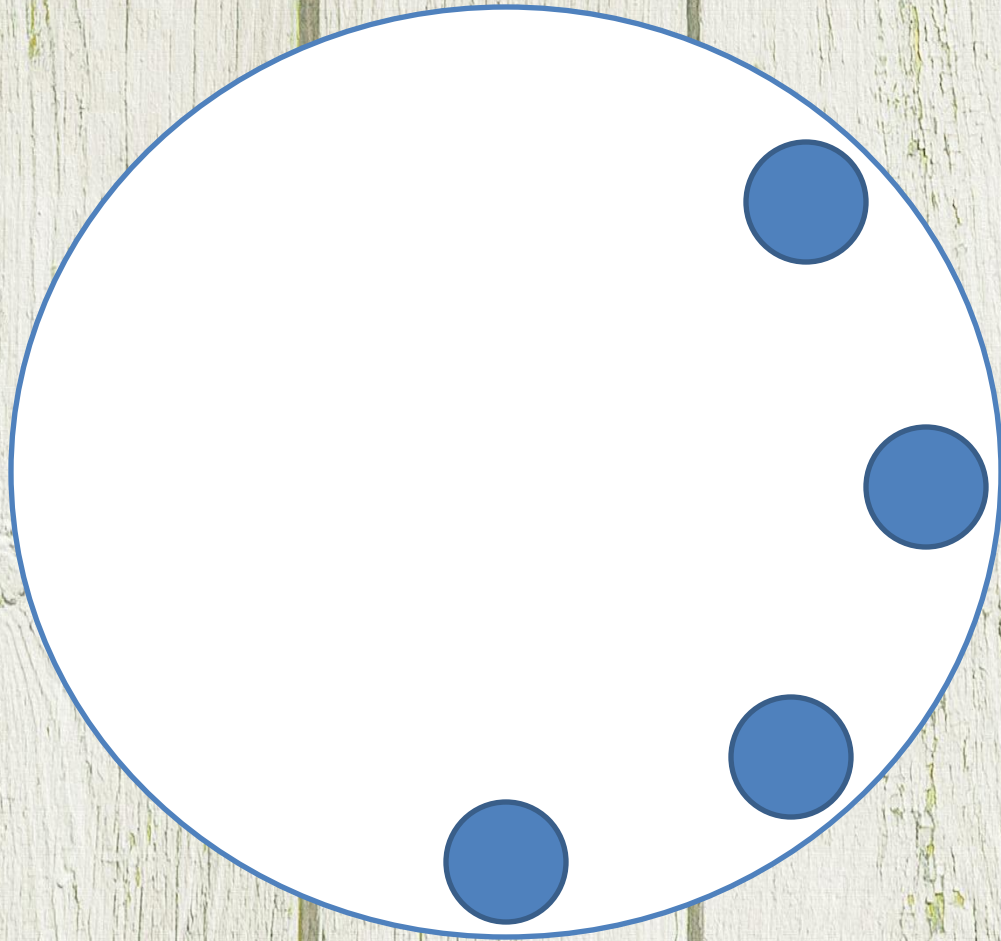
- Просвечивающая электронная микроскопия
- Автоэлектронная и автоионная микроскопия
- Зондовая микроскопия

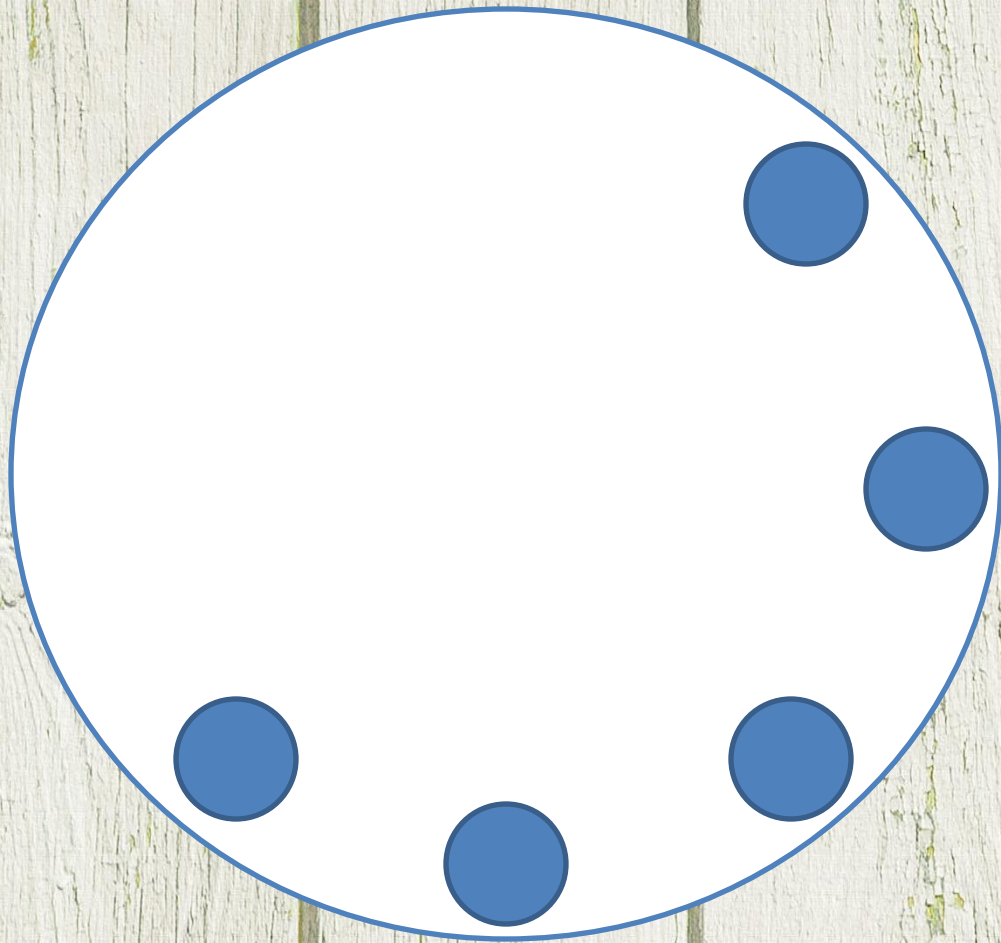
Необходимо ответить на
вопросы

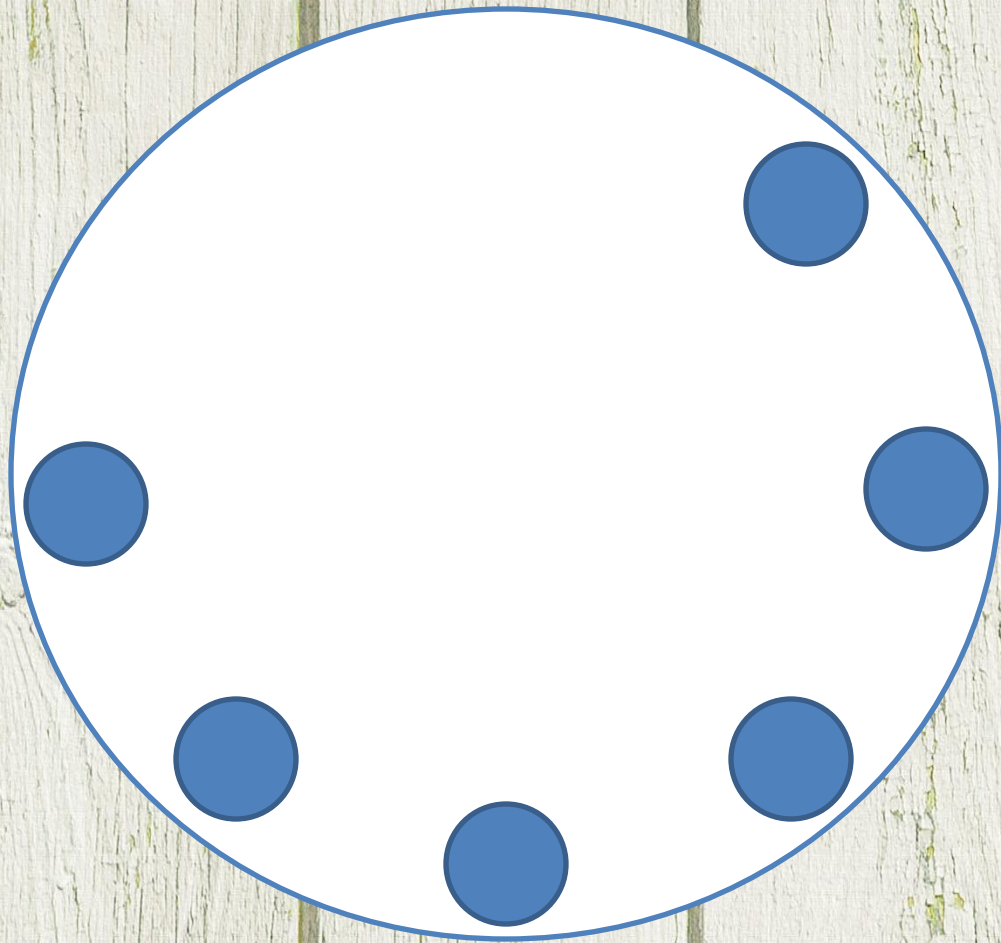


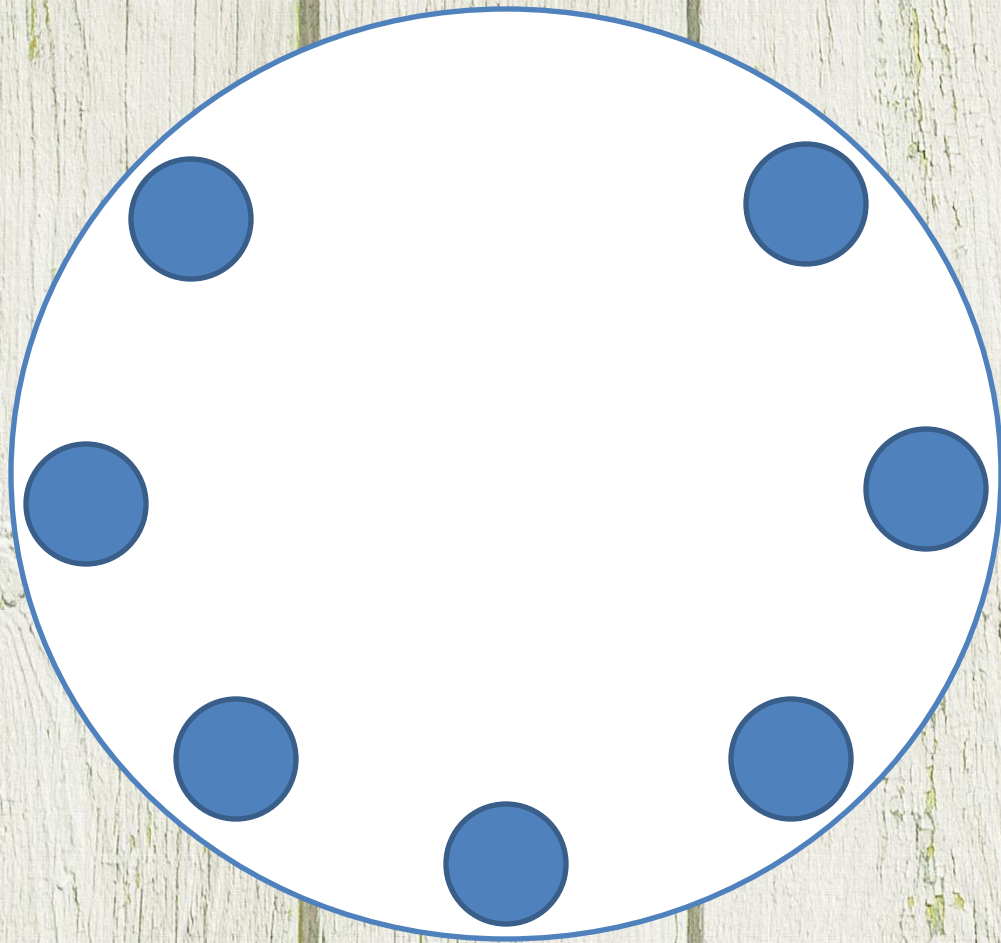


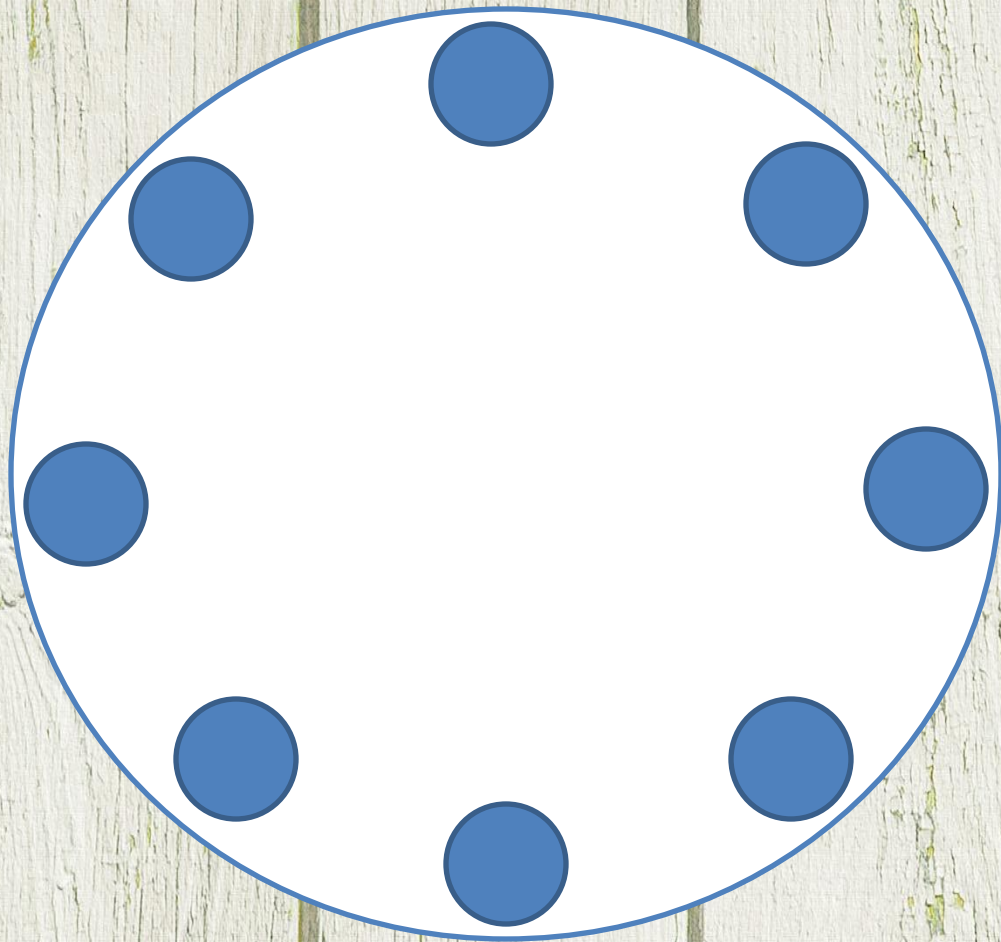


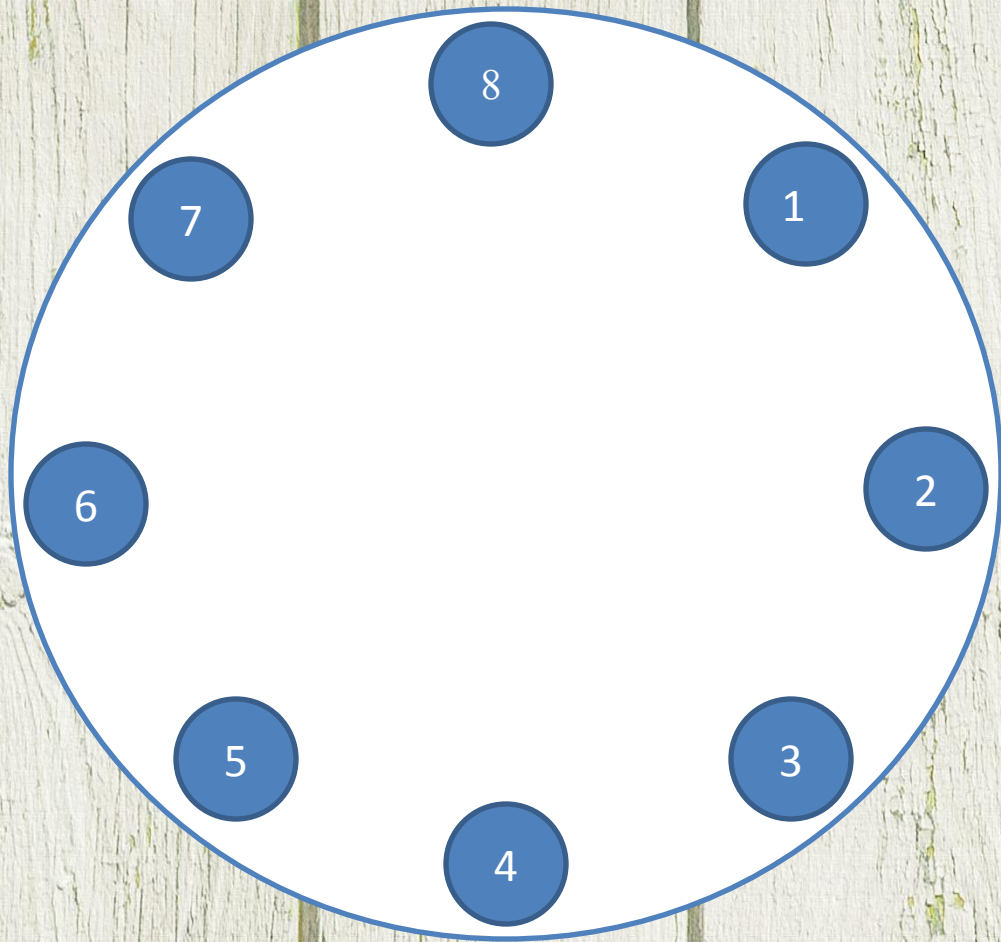


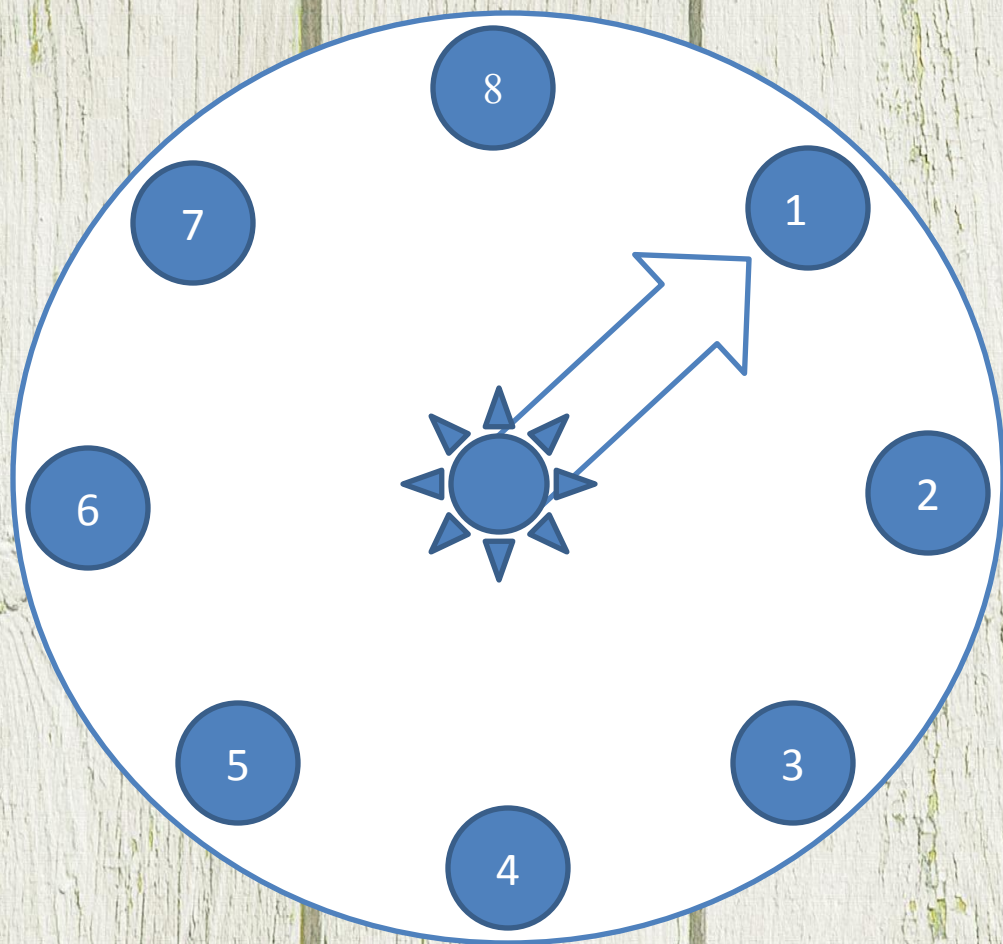


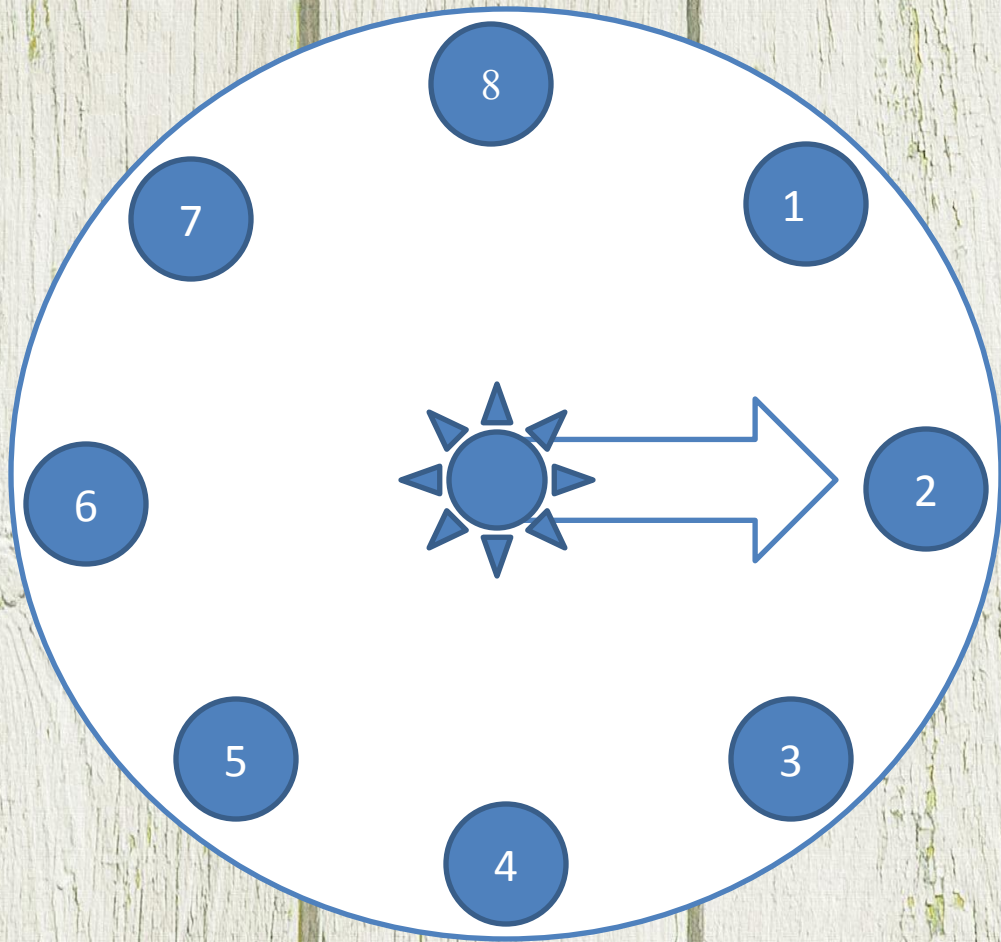


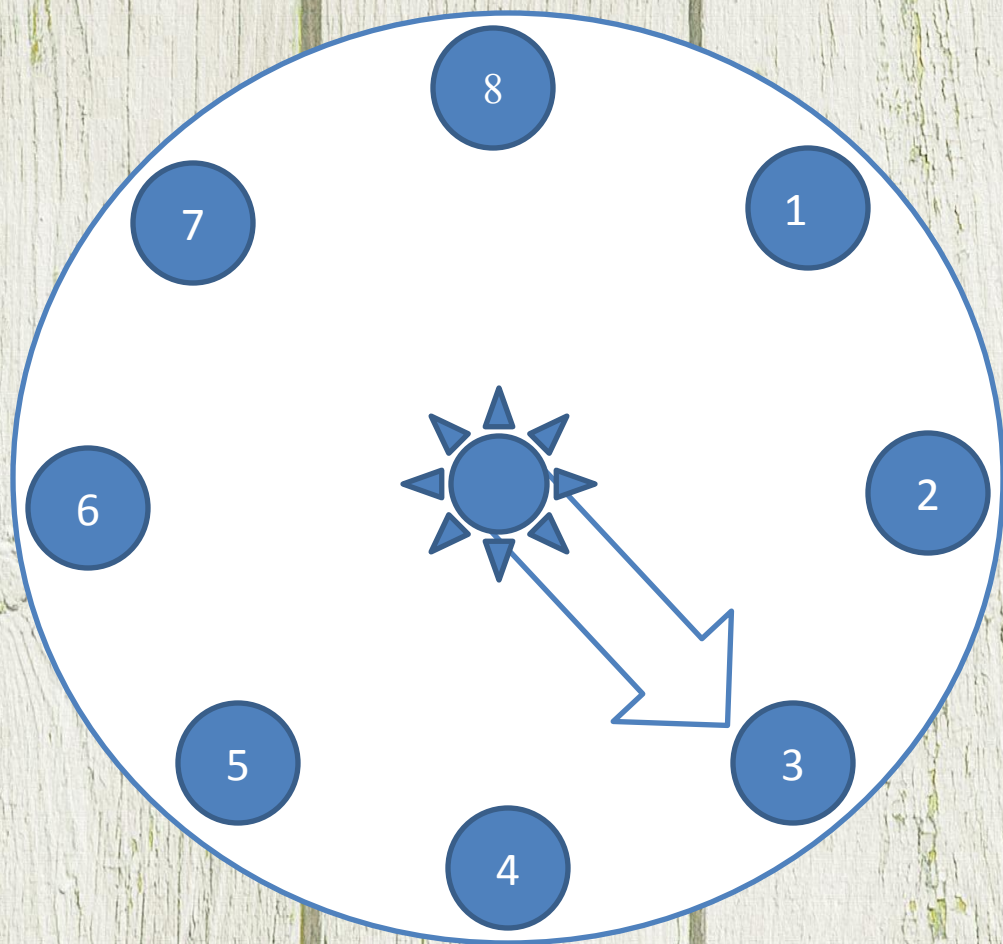


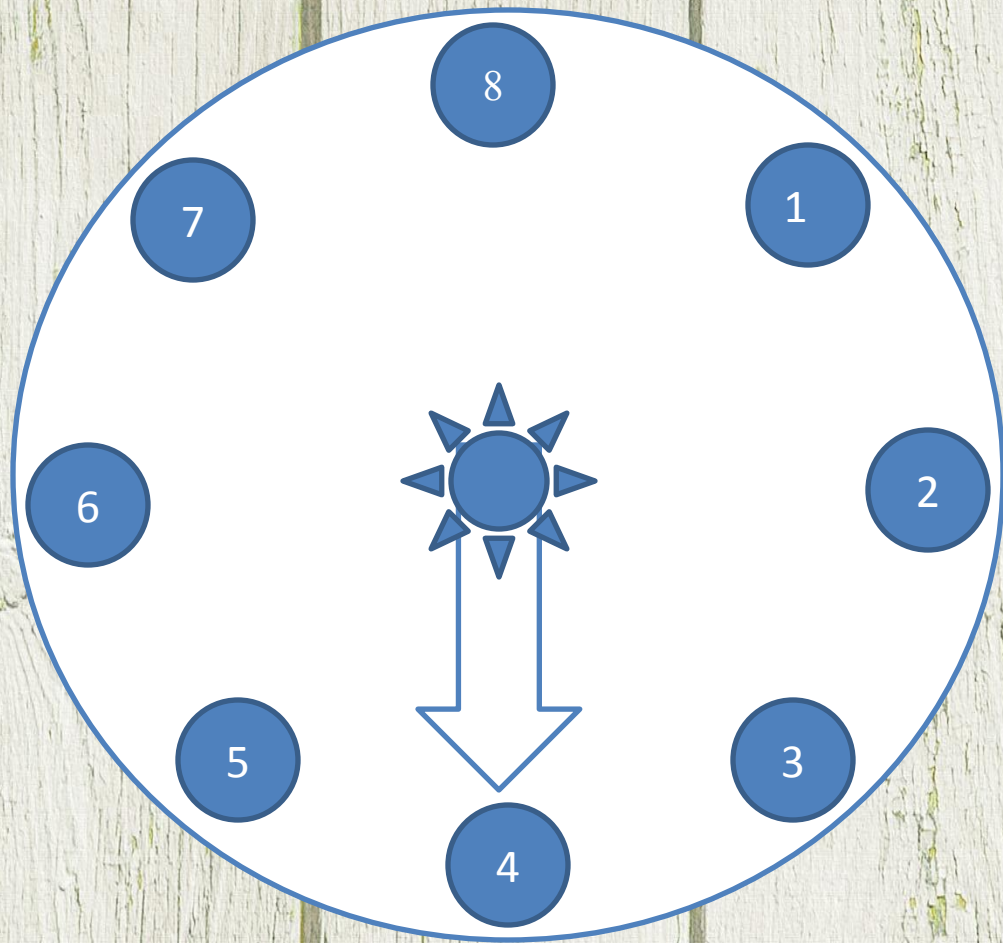


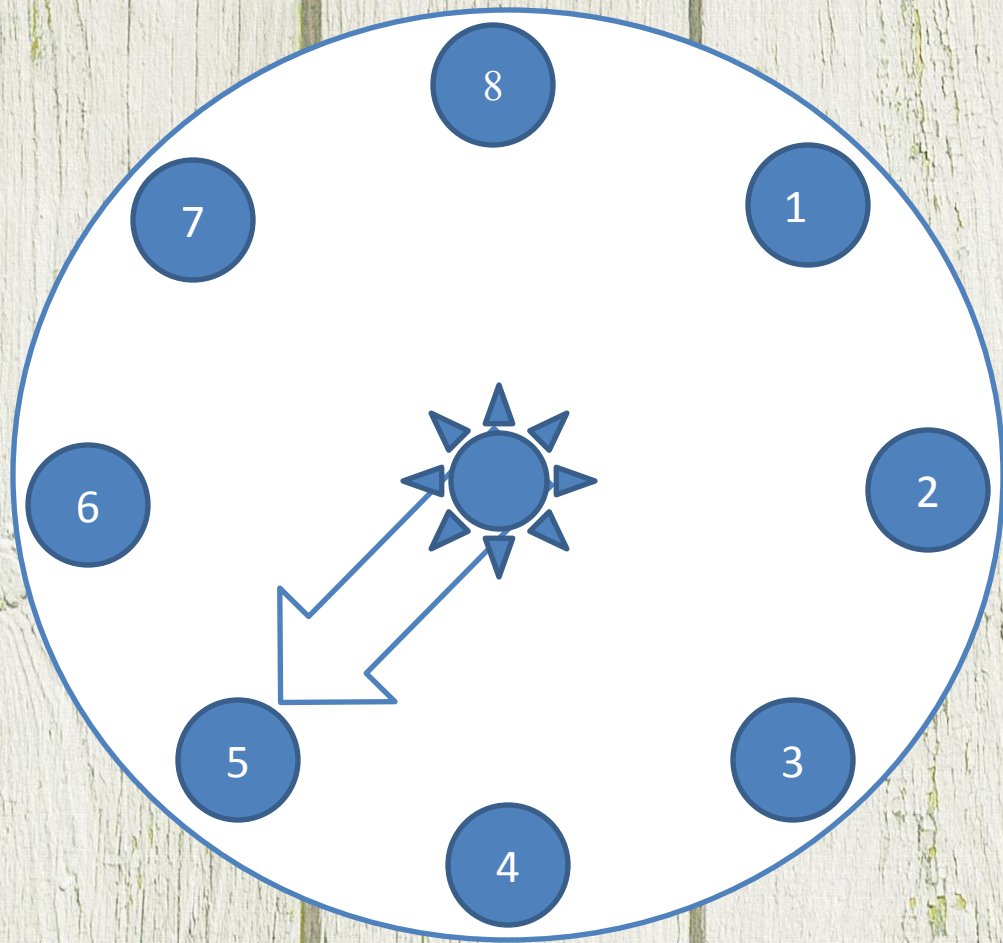


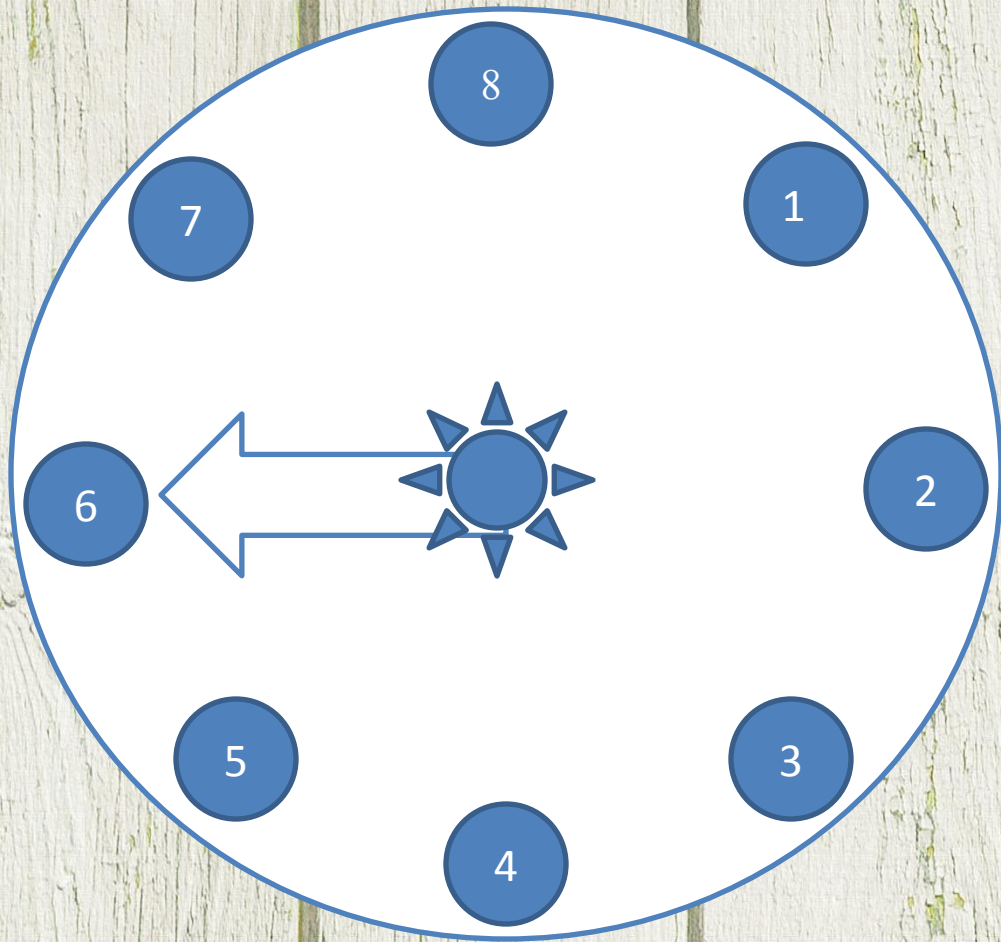


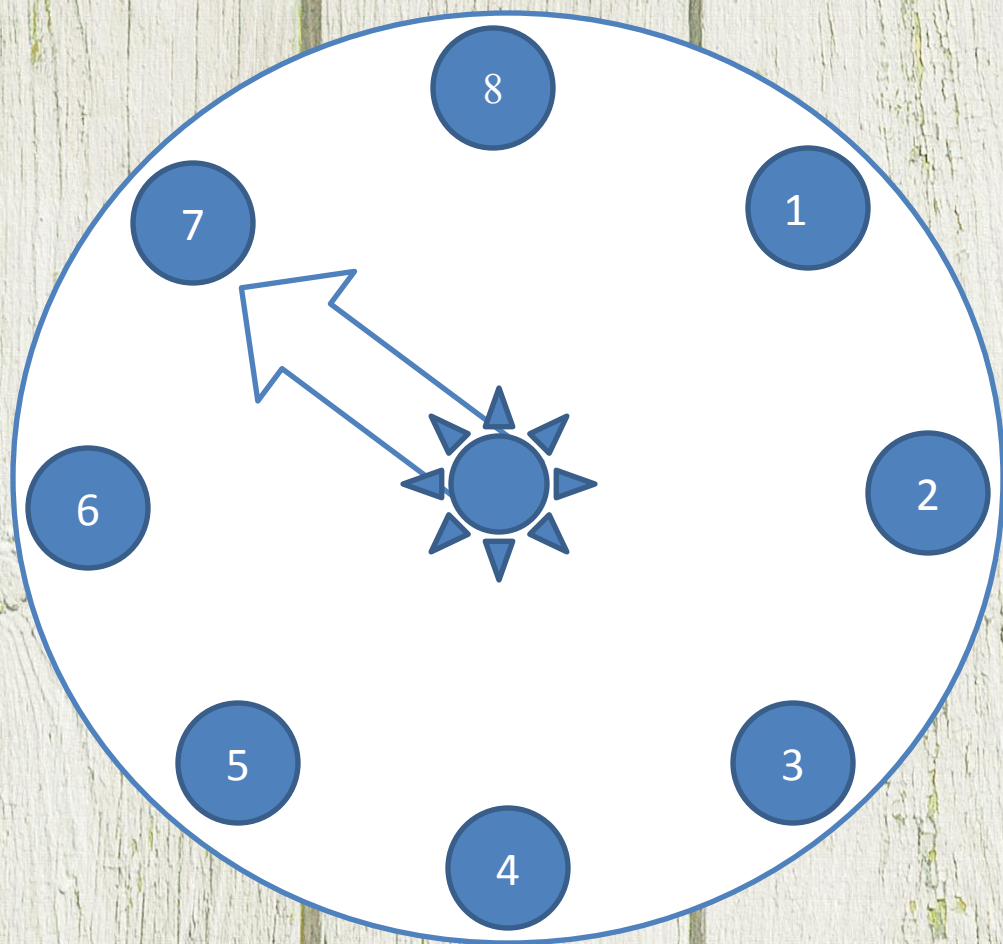


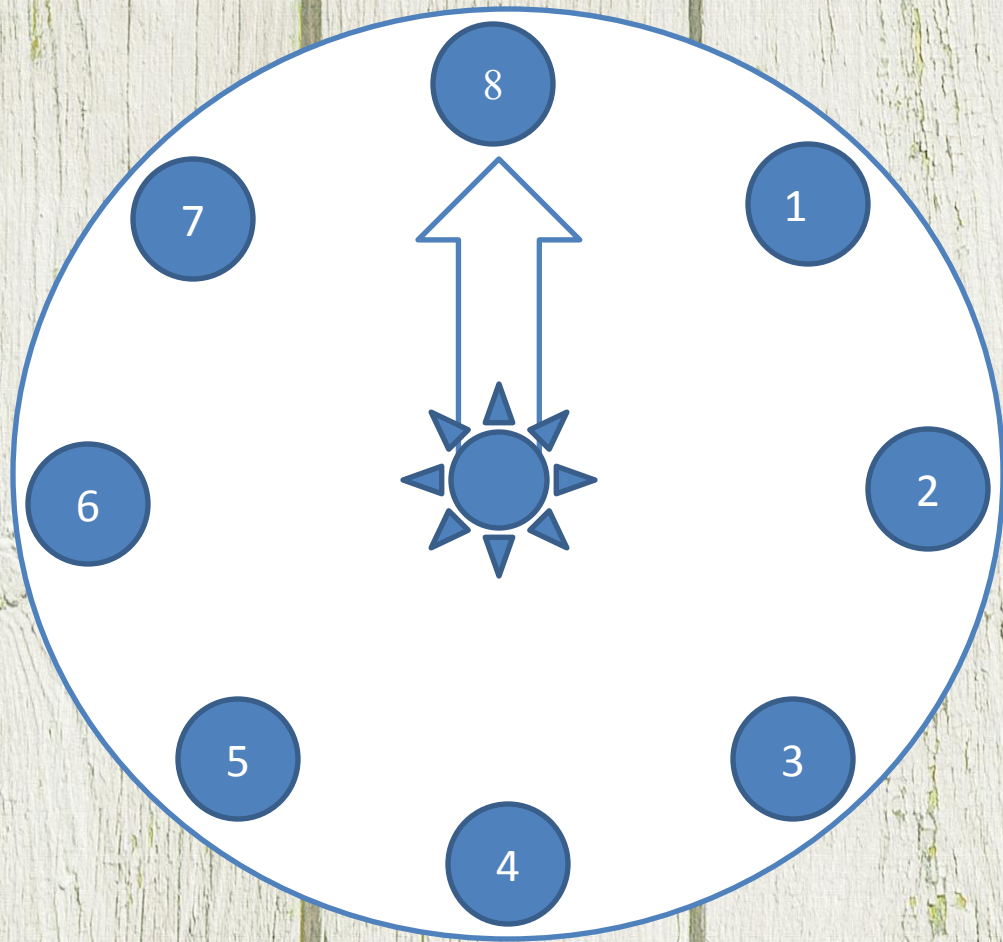












В электронных микроскопах используются:

- 1 - Лучи света
- 2 - Пучки электронов

Вопрос №

1

Какая микроскопия основывается на явлениях эмиссии электронов с поверхности металла под воздействием сильных электрических полей?

1 - Ионно-полевая

2- Электронно-полевая

Вопрос №

2

Детектирование чего лежит в основе сканирующего оптического микроскопа ближнего поля?

- 1 - Электромагнитное излучение**
- 2 – Ток вторичных и отраженных электронов**

Вопрос №

3

При сканирующей электронной микроскопии...

1 – исследуются только тонкие пленки

2 – толщина образца не имеет значения

Вопрос №

4

**У сканирующего туннельного
микроскопа в качестве зонда
выступает...**

1 – металлическая игла

2 - образец

Вопрос №

5

Сканирующая туннельная микроскопия может исследовать...

- 1 – проводящие образцы
- 2 – любые образцы

Вопрос №

6

Атомно-силовая микроскопия может исследовать...

Только
проводящие
образцы

Только
непроводящие
образцы

Только металлы

Любые образцы

Вопрос №

При сканирующей оптической
микроскопии ближнего поля
зондом выступает...

Тонкая металлическая игла

Оптоволокно

Оптический волновод

Образец

Вопрос №

**Ответ
правильный**

**Ответ
неправильный**

Подведение ИТОГОВ

Всего
вопросов

Из них
правильных

Процент
правильных
ответов

Оценка